

ЗАВИСИМОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УЗКОПОЛОСНЫХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ

Ш. А. Фурман

Приведены формулы, удобные для анализа и расчета пропускания в максимуме, отражения в минимуме и полуширины узкополосного фильтра при слабом поглощении и отсутствии поглощения в слоях.

Формулы, определяющие параметры диэлектрических узкополосных пропускающих интерференционных фильтров (ДУПИФ), представляют большой интерес для анализа их оптических свойств и рассмотрения многих практических задач.

Основными оптическими характеристиками узкополосного фильтра являются длина волны λ_{\max} , соответствующая максимуму пропускания, коэффициент пропускания в максимуме T_{\max} и полуширина $\delta\lambda$. Величина $\delta\lambda$ равна разности длин волн в зоне λ_{\max} , соответствующих пропусканию $0.5 T_{\max}$.

Информация о соотношениях, определяющих пропускание в максимуме и полуширину ДУПИФ, имеется в работах [1-4]. Основным недостатком этих формул является их громоздкость, затрудняющая анализ влияния показателей преломления сред, поглощения, числа слоев и других параметров фильтра на величину $\delta\lambda$ и T_{\max} . В настоящей работе выведены новые формулы, свободные от указанных недостатков.

Схематически ДУПИФ типа Фабри—Перо можно изобразить в виде П—З₁—Д—З₂. Данный фильтр состоит из двух многослойных зеркал З₁ и З₂ с высоким отражением и частичным пропусканием в области λ_{\max} , разделенных диэлектрическим слоем Д.

Рассмотрим ДУПИФ, состоящий из m чередующихся плоскопараллельных однородных слоев В и Н с высоким n_V и низким n_H показателями преломления, расположенный на полубесконечной непоглощающей подложке П с показателем преломления n_0 . Первым условимся считать слой, прилегающий к подложке. К последнему слою с номером m прилегает полубесконечная непоглощающая среда с показателем преломления n_{m+1} . Оптические толщины слоев зеркал $n_k d_k = (1/4)\lambda_{\max}$, $k=1, 2, \dots, m_1, m_1+2, \dots, m$. У разделительного слоя $n_{m_1+1} d_{m_1+1} = p\lambda_{\max}/2$, $p=1, 2, \dots$. Причем $m = m_1 + m_2 + 1$, где m_1 и m_2 — число слоев в первом (прилегающем к подложке) и втором зеркалах. Здесь p — порядок фильтра, n_l и d_l — показатель преломления и геометрическая толщина слоя с номером l . Условимся называть ДУПИФ симметричным (несимметричным), если он содержит одинаковое (различное) число слоев в каждом из зеркал.

У реальных ДУПИФ слои отягощены поглощением. В этом случае $n'_V = n_V - i x_V$ и $n'_H = n_H - i x_H$, где x_V , x_H и n'_V , n'_H — показатели поглощения и комплексные показатели преломления материалов слоев В и Н. Под поглощением здесь следует понимать потери, обусловленные истинным поглощением и рассеянием на неоднородностях и дефектах слоев.

Практический интерес представляют сведения о влиянии на полупрозрачность и пропускание в максимуме слабого поглощения в слоях. Разложив рекуррентные формулы Власова [5] в ряд Тейлора в окрестности λ_{\max} , $x_B=0$, $x_H=0$ и выполнив необходимые преобразования, находим выражения, характеризующие $\delta\lambda$ и T_{\max} . Опуская из-за их громоздкости промежуточные выкладки, изложим лишь окончательный вид выведенных формул.

У ДУПИФ

$$\delta\lambda_{1/k} = \sqrt{k-1} \delta\lambda, \quad 1 \leq k \leq 100, \quad (1)$$

где $\delta\lambda_{1/k}$ — ширина полосы в области λ_{\max} , равная разности длин волн, соответствующих пропусканию $(1/k)T_{\max}$. Из (1) видно, что форма спектральной кривой пропускания ДУПИФ в окрестности λ_{\max} в первом приближении не зависит от числа слоев, показателей преломления, поглощения и порядка фильтра.

Пусть поток падает нормально и справедливо ограничение $\beta^{m_1} \ll 1$ и $\beta^{m_2} \ll 1$, где $\beta = n_H/n_B$.

В случае слабого поглощения ($x < 0.01$) и отсутствия ошибок в слоях

$$\frac{\delta\lambda'}{\lambda_{\max}} = (1 + cx_B + dx_H) \frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}}, \quad (2)$$

где $\delta\lambda$ и $\delta\lambda'$ — полуширина фильтра, соответствующая отсутствию и наличию поглощения в слоях.

Если к подложке прилегает слой с n_B , то при четном m_1

$$c = (p + q)u, \quad d = (1 + q)u, \quad q = \frac{n_H^2}{n_B^2 - n_H^2}, \quad (3)$$

при нечетном m_1

$$c = \frac{qu}{\beta}, \quad d = \frac{(p + q)u}{\beta}, \quad (4)$$

где в случае m (нечетного и четного соответственно)

$$u = \frac{\pi}{n_0\beta^{m_1} + n_{m+1}\beta^{m_2}} \quad \text{и} \quad u = \frac{\pi n_{m+1}}{n_0 n_{m+1} \beta^{m_1} + n_B n_H \beta^{m_2}}. \quad (5)$$

При нечетном и четном m соответственно

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}} = \frac{2(n_0\beta^{m_1} + n_{m+1}\beta^{m_2})}{\pi(p + B)n_B}, \quad B = \frac{n_H}{n_B - n_H}, \quad (6)$$

и

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}} = \frac{2(n_0 n_{m+1} \beta^{m_1} + n_H n_B \beta^{m_2})}{\pi(p + B)n_{m+1}n_B}. \quad (7)$$

У симметричного ДУПИФ ($m_1 = m_2$, $m = 2m_1 + 1$), согласно (6),

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}} = \frac{2(n_0 + n_{m+1})}{\pi(p + B)n_B} \left(\frac{n_H}{n_B}\right)^{m_1} = \frac{2(1 - \beta)(n_0 + n_{m+1})}{\pi[p - \beta(p - 1)]n_B} \beta^{m_1}. \quad (8)$$

Если к подложке прилегает слой с n_H , то при нечетном m

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}} = \frac{2n_H(n_{m+1}\beta^{m_1} + n_0\beta^{m_2})}{\pi(p + B)n_0 n_{m+1}}, \quad (9)$$

при четном m

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}} = \frac{2(n_H n_B \beta^{m_1} + n_0 n_{m+1} \beta^{m_2})}{\pi(p + B)n_0 n_B}. \quad (10)$$

У ДУПИФ

$$T_{\max} = \frac{T(\pi)}{(1 + cx_B + dx_H)^2}, \quad R_{\min} = \frac{(\varepsilon + cx_B + dx_H)^2}{(1 + cx_B + dx_H)^2}, \quad (11)$$

$$T(\pi) + R(\pi) = 1,$$

где T_{\max} , R_{\min} и $T(\pi)$, $R(\pi)$ — энергетические коэффициенты пропускания фильтра в максимуме и отражения в минимуме соответственно при слабом поглощении и отсутствии поглощения в слоях для потока, идущего в направлении от среды с номером $m+1$ к среде с индексом 0.

Если к подложке прилегает слой с n_B , то нечетному m соответствуют

$$\varepsilon = \frac{n_0 \beta^{m_1 - m_2} - n_{m+1}}{n_0 \beta^{m_1 - m_2} + n_{m+1}}, \quad T(\pi) = \frac{4n_0 n_{m+1} \beta^{m_1 - m_2}}{(n_0 \beta^{m_1 - m_2} + n_{m+1})^2}, \quad (12)$$

при четном m

$$\varepsilon = \frac{n_0 n_{m+1} \beta^{m_1 - m_2} - n_B n_H}{n_0 n_{m+1} \beta^{m_1 - m_2} + n_B n_H}, \quad T(\pi) = \frac{4n_B n_H n_0 n_{m+1} \beta^{m_1 - m_2}}{(n_0 n_{m+1} \beta^{m_1 - m_2} + n_B n_H)^2}. \quad (13)$$

Входящие в (14) величины c и d определяются согласно (3) — (5).

При наличии поглощения в слоях пропускание не зависит, а отражение зависит от направления падения потока. Если поток падает на покрытие со стороны среды с индексом 0, то коэффициенты c и d остаются неизменными, а выражение ε в (12) и (13) изменяет знак.

Достоинство формул (2) — (11) заключается в том, что они удобны для анализа и практических расчетов. Эти формулы позволяют с единой позиции производить оценку степени влияния поглощения, числа слоев, показателей преломления сред и других параметров на пропускание (отражение) и полуширину различных вариантов фильтров, а также анализировать их свойства. Например, из (8) следует, что

$$\left. \begin{aligned} \frac{\delta \lambda (m'_1)}{\delta \lambda (m''_1)} &= \left(\frac{n_H}{n_B} \right)^{m'_1 - m''_1}, & \frac{\delta \lambda (n'_{m+1})}{\delta \lambda (n''_{m+1})} &= \frac{n_0 + n'_{m+1}}{n_0 + n''_{m+1}}, \\ \frac{\delta \lambda (p_1)}{\delta \lambda (p_2)} &= \frac{p_2 + B}{p_1 + B}, & \frac{\delta \lambda (n'_B)}{\delta \lambda (n''_B)} &= \frac{(p + B'') (n''_B)^{m+1}}{(p + B') (n'_B)^{m+1}}. \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

Здесь приведены отношения полуширин двух симметричных непоглощающих ДУПИФ, у которых все параметры одинаковы, кроме указанного в круглых скобках. Примеры (табл. 1), рассчитанные по формулам (14), показывают, что у симметричного ДУПИФ изменение числа слоев зеркал, отношения показателей преломления слоев, порядка и показателей преломления обрамляющих сред оказывают заметное влияние на полуширину фильтра.

Таблица 1

Влияние изменения числа слоев, показателей преломления сред и порядка на полуширину симметричного ДУПИФ

$n_B = 2.30, \quad n_H = 1.35$				$n_B = 2.30, \quad n_H = 1.35, \quad p_1 = 1$				
$m'_1 - m''_1$	1	2	5	p_2	2	3	10	
$\frac{\delta \lambda (m'_1)}{\delta \lambda (m''_1)}$	1.70	2.90	14.35	$\frac{\delta \lambda (p_1)}{\delta \lambda (p_2)}$	1.41	1.83	4.72	
m	$n_H = 1.35, \quad n'_B = 2.30, \quad n''_B = 2.70$			n_0	1.52	1.00		
	$p = 1$		$p = 5$		n'_{m+1}	1.00	1.52	
	13	21	13		21	n''_{m+1}	1.52	1.80
	$\frac{\delta \lambda (n'_B)}{\delta \lambda (n''_B)}$	2.54	4.82		2.87	5.45	$\frac{\delta \lambda (n''_{m+1})}{\delta \lambda (n'_{m+1})}$	1.21

Формулы (2)—(11) можно также вывести путем соответствующих преобразований известных выражений [1, 4], связывающих T_{\max} и полуширину фильтра с коэффициентами отражения, пропускания и поглощения зеркала и разделительного слоя.

В ряде случаев необходимо иметь возможность плавного изменения полуширины изготавливаемого фильтра. Этого эффекта можно достичь, если на симметричный ДУПИФ нанести дополнительный слой из материала с показателем преломления n_H . Варьируя оптическую толщину добавленного слоя H от 0 до $0.25 \lambda_{\max}$, можно осуществлять плавное регулирование полуширины без уменьшения T_{\max} фильтра. Согласно (7) и (8), при $n_{m+1} = 1.0$

$$\frac{(\delta\lambda)_H}{\delta\lambda} = \frac{n_0 + n_H^2}{n_0 + 1}, \quad (15)$$

где $\delta\lambda$ и $(\delta\lambda)_H$ — полуширина симметричного и дополненного четвертьволновым слоем H непоглощающего ДУПИФ. Выражение (15) позволяет оценить пределы указанного изменения полуширины. Так, при $n_0 = 1.52$ и $n_H = 1.35$ они составляют 33%.

Рассмотрим еще один вариант плавного изменения $\delta\lambda$ фильтра. Обратимся к табл. 2, где приведены зависимости, рассчитанные по точным формулам [6], параметров 17-слойного фильтра 17-ПВНВНВНВН—4-В—НВНВНВНВ', $V' = \gamma V$ второго порядка от относительной оптической толщины γ последнего слоя. Влияние второй поверхности (без покрытия) подложки не учитывалось.

Т а б л и ц а 2

Влияние толщины последнего слоя на параметры 17-слойного непоглощающего ДУПИФ

$m = 17; m_1 = m_2 = 8, p = 2, n_0 = 1.52, n_B = 2.30, n_H = 1.35, n_{m+1} = 1.0$					
γ	$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}}$	$T_{\max}, \%$	γ	$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}}$	$T_{\max}, \%$
0.20	0.0061	82.2	0.60	0.0033	99.7
0.30	0.0049	92.1	0.80	0.0030	97.1
0.35	0.0045	95.2	1.00	0.0029	95.7
0.40	0.0042	97.3	1.20	0.0030	97.2

Из табл. 2 видно, что, изменяя толщину последнего слоя симметричного ДУПИФ, можно варьировать до 55% полуширину фильтра при сохранении высокого значения $T_{\max} > 95\%$.

Информация о ширине полосы, выделяемой фильтром, пропускании в максимуме и величине R_{\min} представляет большой интерес, так как позволяет рассмотреть ряд важных задач. Например, определить монохроматичность фильтра, проследить изменения полуширины и T_{\max} по мере увеличения числа пленок покрытия. Это облегчает выбор оптимальной схемы контроля толщин слоев при формировании ДУПИФ и анализ различных ситуаций, возникающих в процессе изготовления фильтра.

В литературе практически отсутствуют сведения о показателях поглощения веществ, входящих в состав большинства ДУПИФ. Выражение, характеризующее T_{\max} фильтра, позволяет весьма просто оценить величины показателей поглощения тонких слоев. Если положить $\kappa_B = \kappa_H = \kappa$, то, согласно (11),

$$\kappa = \frac{1}{c + a} \left(\sqrt{\frac{T(\pi)}{T_{\max}}} - 1 \right). \quad (16)$$

При четном m_1 и $p = 1$

$$\kappa_B + \kappa_H = \frac{1}{c} \left(\sqrt{\frac{T(\pi)}{T_{\max}}} - 1 \right). \quad (17)$$

Таблица 3
 Оптические характеристики симметричных ДУПИФ, изготовленных
 термическим испарением в вакууме

$n_0 = 1.52, \quad n_{m+1} = 1.00, \quad n_H = 1.33, \quad p = 2$

число слоев	материал слоев		эксперимент			расчет			
	В	Н	$\lambda_{\max}, \text{Å}$	$\delta\lambda', \text{Å}$	$T_{\max}, \%$	n_B	c	d	$x_B = x_H = x$
17	ZnS	Na ₃ AlF ₆	4861	12	70	2.36	301	179	0.00035
17			5893	15	70	2.35	292	174	0.00036
21			6986	8	64	2.28	690	416	0.00020
17			10600	34	86	2.25	216	131	0.00016
21			13346	20	70	2.21	518	316	0.00020
25			PbF ₂	3392	14	74	1.85	201	135
23	ZnSe	6491	2.1	33	2.50	979	5972	0.00010	

В табл. 3 в качестве иллюстрации приведены показатели поглощения x , вычисленные, согласно (16), на основе экспериментальных данных. При расчете n_B и x влияние ошибок в толщинах слоев не учитывалось.

Очевидный недостаток формулы (16) связан с тем обстоятельством, что мы полагаем $x_B = x_H$, в то время как фактически $x_B \neq x_H$. Выражение (17) позволяет находить лишь сумму $x_B + x_H$. Рассмотрим способ определения показателей поглощения отдельных веществ фильтра. Для этой цели необходимы два ДУПИФ высокого порядка с близкими λ_{\max} и m , состоящие из одинаковых материалов. Пусть у одного из них показатель преломления разделительного слоя n_B , а у другого — n_H . По значениям T_{\max} такой пары фильтров можно оценить соотношение между x_B и x_H .

Если $x_H \leq x_B$ и $P > 10$, то при четном m_1 , согласно (3), $cx_B \gg dx_H$ и, следовательно,

$$x_B \approx \frac{1}{c} \left(\sqrt{\frac{T(\pi)}{T_{\max}}} - 1 \right). \quad (18)$$

В случае $x_B \leq x_H$, $p > 5$ и нечетного m_1

$$x_H \approx \frac{1}{d} \left(\sqrt{\frac{T(\pi)}{T_{\max}}} - 1 \right). \quad (19)$$

Если из эксперимента известны значения $\delta\lambda'$ и T_{\max} ДУПИФ, то по ним легко определить относительную полуширину фильтра, соответствующую отсутствию поглощения в слоях. Воспользовавшись (2) и (11), находим

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}} = \sqrt{\frac{T_{\max}}{T(\pi)}} \frac{\delta\lambda'}{\lambda_{\max}}. \quad (20)$$

Выражение (20) позволяет оценить вклад в полуширину, обусловленный поглощением в слоях реального ДУПИФ, а также определить показатель преломления одного из материалов фильтра. Например, если известен n_H , то, вычислив на основе (20) $\delta\lambda$, согласно (8), находим n_B . Этим способом были вычислены значения n_B , приведенные в табл. 3.

Учет влияния поглощения на параметры представляет особый интерес, так как даже слабое поглощение в слоях может заметно изменить полуширину и T_{\max} фильтра. Степень влияния поглощения резко возрастает по мере уменьшения $\delta\lambda$. Так, из табл. 4, где приведены рассчитанные по формулам (2) и (11) значения $\delta\lambda'$, T_{\max} и R_{\min} ДУПИФ, видно, что переход от $x_B = x_H = 0$ (отсутствие поглощения) к $x_B = x_H = 0.0002$ при $m = 17$ почти не влияет на $\delta\lambda$, а у фильтра с $m = 29$ вызывает увеличение полуширины в два раза и снижает T_{\max} до 18%.

Т а б л и ц а 4

Влияние слабого поглощения на параметры симметричных ДУПИФ

$$n_0 = 1.52, \quad n_B = 2.30, \quad n_H = 1.35, \quad n_{m+1} = 1.0$$

m	p	приближенные формулы						точные формулы		
		$x_B = x_H = 0.0002$			$x_B = x_H = 0.0$			$x_B = x_H = 0.0002$		
		$\frac{\delta\lambda'}{\lambda_{\max}}$	$T_{\max}, \%$	$R_{\min}, \%$	$\frac{\delta\lambda}{\lambda_{\max}}$	$T_{\max}, \%$	$R_{\min}, \%$	$\frac{\delta\lambda'}{\lambda_{\max}}$	$T_{\max}, \%$	$R_{\min}, \%$
9	1	0.0344	94.53	4.47	0.0342	95.74	4.26	0.0388	94.58	4.44
17	1	0.0043	86.18	6.10	0.0041			0.0043	86.23	6.07
17	2	0.0031	83.36	6.73	0.0029			0.0031	83.40	6.70
17	10	0.00104	65.07	11.97	0.00086			0.00104	65.06	11.92
19	1	0.00263	78.36	7.95	0.00238			0.00265	78.39	7.92
21	1	0.00162	71.55	9.85	0.00140			0.00162	71.58	9.82
25	1	0.00070	45.23	20.66	0.00048			0.00070	45.23	20.62
25	5	0.00037	22.75	37.59	0.00018			0.00036	22.75	37.55
29	1	0.00038	17.78	43.29	0.00017			0.00039	17.77	43.26
33	1	0.00028	4.10	69.86	0.00006			0.00028	4.10	69.81

Важно отметить, что вычисленные на основе (2) и (11) значения $\delta\lambda'$ и T_{\max} ДУПИФ хорошо согласуются с экспериментальными данными.

В заключение остановимся на погрешности приближенных формул (2) — (11). Сопоставление значений параметров, рассчитанных по точным и приближенным формулам, показывает, что они лишь незначительно отличаются. Например, из табл. 4, где приведены значения параметров ДУПИФ, вычисленных с помощью соотношений (2) — (11) и на основе данных о спектральных кривых пропускания, рассчитанных по точным формулам [6], следует, что погрешность приближенных формул (2) — (11) лежит в пределах 1% для ДУПИФ с $\delta\lambda/\lambda_{\max} < 0.004$. С увеличением относительной ширины погрешность возрастает.

Выражаю благодарность Н. М. Слотиной за помощь в расчетах.

Литература

- [1] Г. В. Розенберг. Оптика тонкослойных покрытий. Изд. АН СССР, М., 1958.
- [2] А. С. Валеев. Опт. и спектр., 17, 93, 1964.
- [3] В. Б. Яфаева, А. С. Валеев. Опт. и спектр., 17, 102, 1964.
- [4] Ш. А. Фурман. Опт.-мех. промышл., № 9, 50, 1968.
- [5] А. Г. Власов. Опт.-мех. промышл., № 2, 11, 1946.
- [6] Н. Рохлак. Jenaer Jahrbuch, 101, 1952.

Поступило в Редакцию 7 августа 1972 г.